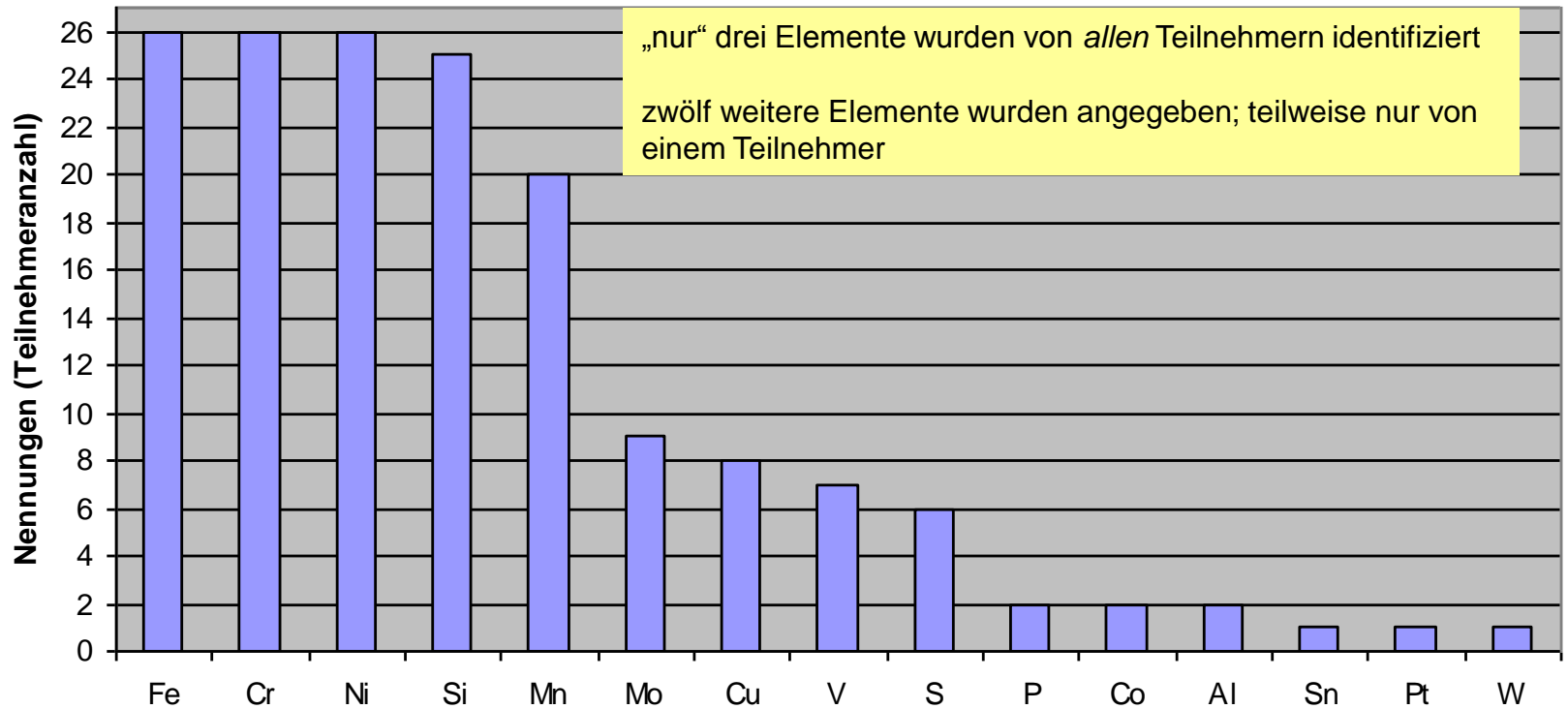


Laborvergleich EDX 2009

Martin Bühner

nanoAnalytics GmbH

Häufigkeit der Nennung einzelner Elemente in Probe A



Konzentrationen der drei Hauptelemente aufgeschlüsselt nach verschiedenen Kriterien

	Anzahl	Eisen	H	Chrom	H	Nickel	H
Probe A							
Hersteller							
A	8	75,9	1,0	17,0	1,0	7,1	0,2
B	8	74,1	0,2	18,6	0,3	7,3	0,2
C	6	74,8	0,3	17,8	0,7	7,4	0,4
D	2	74,7	0,4	18,2	0,2	7,1	0,2
E	1	75,5		17,6		6,9	
Technologie							
Si(Li)	16	74,4	0,5	18,2	0,6	7,3	0,3
SDD	9	75,8	1,0	17,1	1,0	7,1	0,2
Beschleunigungsspannung [kV]							
30	2	74,7	1,0	18,1	0,7	7,2	0,3
25	1	75,5		17,6		6,9	
20	18	74,9	1,1	17,8	1,0	7,3	0,3
15	2	75,3	0,1	17,6	0,4	7,1	0,3
Referenzanalysen							
WDX		74,4		17,8		7,8	
ICP-OES		74,8		17,6		7,6	

Zusammenfassung

- gute Identifikation und Quantifizierung der Hauptelemente ($>>1\%$)
- Bei Spurenelementen ($<\sim 1\%$) ist die Kernfrage: Welches Element ist vorhanden?
- Nachweisgrenze auch $<0,1\%$



nanoAnalytics GmbH

Martin Bühner

Heisenbergstraße 11

48149 Münster

fon: +49.(0)251.53406300

fax: +49.(0)251.53406310

buehner@nanoanalytics.de

www.nanoanalytics.de